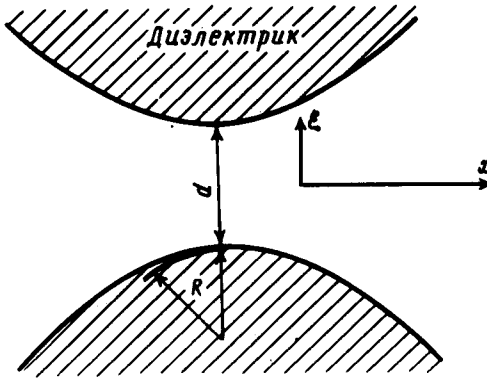


КВАНТОВЫЙ ИЗБЫТОЧНЫЙ ШУМ В ДВУМЕРНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ МИКРОКОНТАКТАХ

Г.Б.Лесовик

Показано, что в условиях, когда матрица коэффициентов прозрачности t_{nm} , описывающая транспорт, диагональна и t_{nn} равны единице или нулю, а кондактанс G точно квантуется в единицах $e^2/\pi\hbar$, избыточный шум в пренебрежении неупругими процессами отсутствует. Поэтому спектральная интенсивность избыточного шума $S_{\nu}(\omega)$ максимальна в узкой области параметров, отвечающих переходу от $G = \frac{e^2}{\pi\hbar} n$ к $G = \frac{e^2}{\pi\hbar} (n+1)$.

Рассмотрим микроконтакт, реализованный в виде микросужения в двумерном электронном слое с плавной границей раздела проводящей и диэлектрической области (рис.). Такие микроконтакты использованы в экспериментах по наблюдению квантования сопротивления в зависимости от ширины d ^{1,2}. В работе³ показано, что переменные в уравнении Шредингера для такой геометрии в адиабатическом приближении разделяются и кондактанс G может быть выражен по многоканальной формуле Ландауера⁴ через сумму коэффициентов прозрачности в каждом канале (при $k_B T = 0$) следующим образом: $G = \frac{e^2}{\pi\hbar} \sum_n D_n(\epsilon_F)$. Коэффициенты $D_n(\epsilon_F)$ были вычислены как функции ширины d и радиуса кривизны микросужения R . Полученные зависимости объясняют экспериментально наблюдавшуюся ступенеобразную зависимость G от ширины d . На плато кондактанс оказывался равным $G = \frac{e^2}{\pi\hbar} n$, n – целое число. Это соответствует ситуации, когда n каналов полностью открыты, а остальные закрыты.



В данной работе показано, что спектральная плотность избыточного токового шума может быть выражена через те же коэффициенты прозрачности $D_n(\epsilon)$, и в специфической ситуации, когда все D_n либо 0, либо 1, избыточный шум в пренебрежении неупругими процессами отсутствует. (Избыточным принято называть шум, возникающий при протекании конечного тока в дополнение к равновесному найквистовскому).

Оператор полного тока

$$\hat{I}(x, t) = \frac{ie\hbar}{2m} \int d\xi (\vec{\nabla} \hat{\Psi}^*(\mathbf{r}, t) \hat{\Psi}(\mathbf{r}, t) - \hat{\Psi}^*(\mathbf{r}, t) \vec{\nabla} \hat{\Psi}(\mathbf{r}, t)) \quad (1)$$

выражается через $\hat{\Psi}$ – операторы системы, которые имеют вид:

$$\hat{\Psi} = \sum_n \int \frac{dp}{\pi\hbar} \hat{a}_n(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} - \frac{i}{\hbar} \left(\frac{p^2}{2m} - \mu - \frac{eV}{2} \right) t \varphi_n(\xi) A_n \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{eV}{2} \right) +$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_n \int \frac{dp}{\pi \hbar} \hat{b}_n^\dagger(p) e^{-\frac{i}{\hbar}(\frac{p^2}{2m} - \mu + \frac{eV}{2})t} \varphi_n(\xi) \left\{ e^{-i\frac{p}{\hbar}x} + B_n \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{eV}{2} \right) e^{i\frac{p}{\hbar}x} \right\} \\
\hat{\Psi}^\dagger & = \sum_n \int \frac{dp}{\pi \hbar} \hat{a}_n^\dagger(p) e^{-i\frac{p}{\hbar}x + \frac{i}{\hbar}(\frac{p^2}{2m} - \mu - \frac{eV}{2})t} \varphi_n^*(\xi) A_n^* \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{eV}{2} \right) + \\
& + \sum_n \int \frac{dp}{\pi \hbar} \hat{b}_n^\dagger(p) e^{\frac{i}{\hbar}(\frac{p^2}{2m} - \mu + \frac{eV}{2})t} \varphi_n^*(\xi) \left\{ e^{i\frac{p}{\hbar}x} + B_n^* \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{eV}{2} \right) e^{-i\frac{p}{\hbar}x} \right\}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Здесь μ — химический потенциал электронов, V — разность потенциалов на берегах, A_n , B_n — амплитуды прошедшей и отраженной волны в соответствующем канале, \hat{a}^\dagger , \hat{a} — операторы рождения и уничтожения частиц в левом резервуаре, \hat{b}^\dagger , \hat{b} — в правом.

Искомое выражение для спектральной плотности избыточного шума

$$S_v(\omega) = \int dt e^{i\omega t} \left(\frac{1}{2} \langle \hat{I}(t) \hat{I}(0) + \hat{I}(0) \hat{I}(t) \rangle - \langle \hat{I} \rangle^2 \right) - S_0(\omega)$$

(здесь угловые скобки означают усреднение по матрице плотности, $S_0(\omega)$ — спектральная плотность равновесного шума) имеет вид:

$$\begin{aligned}
S_v(\omega) & = \frac{e^2}{\pi^2 \hbar^2} \sum_{+, -, k} \int d\epsilon \{ n^a(\epsilon \pm \omega) (1 - n^a(\epsilon)) D_k(\epsilon \pm \omega) D_k(\epsilon) + \\
& + n^a(\epsilon \pm \omega) (1 - n^b(\epsilon)) D_k(\epsilon \pm \omega) (1 - D_k(\epsilon)) + n^b(\epsilon \pm \omega) (1 - n^a(\epsilon)) D_k(\epsilon) (1 - D_k(\epsilon \pm \omega)) + \\
& + n^b(\epsilon \pm \omega) (1 - n^b(\epsilon)) D_k(\epsilon \pm \omega) D_k(\epsilon) \} - S_0(\omega).
\end{aligned} \tag{3}$$

Здесь $n^a(\epsilon) = [\exp(\frac{\epsilon - eV/2}{k_B T}) + 1]^{-1}$, $n^b(\epsilon) = [\exp(\frac{\epsilon + eV/2}{k_B T}) + 1]^{-1}$, $D_k(\epsilon) = |A_k(\epsilon)|^2$.

В случае, когда температура T равна нулю, а $eV \ll \Delta E$, где ΔE — характерный масштаб, на котором меняется прозрачность, мы получим из (3) следующую формулу для самых малых частот:

$$S_v(\omega = 0) = \frac{e^2}{\pi^2 \hbar} eV \sum_n D_n (1 - D_n) \tag{4}$$

Заметим, что если все $D_n \ll 1$, эта формула дает обычный дробовой шум: $S_v(\omega = 0) = \frac{e \langle I \rangle}{\pi}$.

Если же все коэффициенты D_n либо ноль, либо единица, то избыточный шум отсутствует. Полученные в ³ зависимости $D_n(\epsilon)$ имеют вид $D_n(\epsilon) = (1 + \exp(-\epsilon/\Delta E_n))^{-1}$ (здесь $\Delta E_n = \hbar^2 n / \sqrt{2Rd^3 m}$), и мы видим, что отличный от нуля вклад в S_v возникает только при $\mu \sim E_n$. В ситуации, когда $\mu = E_n$, можно получить следующие формулы для различных предельных случаев:

$$S_v(\omega = 0) = \frac{e^2}{\pi^2 \hbar} \frac{(eV)^2}{4k_B T} \quad (eV \ll k_B T \ll \Delta E_n) \tag{5}$$

$$S_v(\omega = 0) = \frac{e^2}{\pi^2 \hbar} \frac{(eV)^2}{6\Delta E_n} \quad (eV, \Delta E_n \ll k_B T). \tag{6}$$

Масштаб спада $S_v(\omega)$ по частоте — наименьшая из величин eV/\hbar , $k_B T/\hbar$, $\Delta E_n/\hbar$.

Автор благодарен Л.Б.Иоффе, Д.Е.Хмельницкому, А.И.Ларкину за обсуждения.

Литература

1. *Van Wees B.J., van Houten H., Beenakker C.W.J. et al.* Phys. Rev. Lett., 1988, 60, 848.
2. *Wharam D.A., Thornton T.J. et al.* J. Phys. C, 1988, 21, L209.
3. *Глазман Л.И., Лесовик Г.Б., Хмельницкий Д.Е., Шехтер Р.И.* Письма в ЖЭТФ, 1988, 48, 218.
4. *Landauer R.* In: Localization, Interaction, and Transport Phenomena, Springer-Verlag, 1984.

Институт физики твердого тела
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
28 марта 1989 г.